# 定量性を備えた昇温脱離装置を用いた計測技術の開発

牛木龍二·恩田紘樹

# Development of measurement technology by quantitative temperature programmed desorption apparatus Ryuji USHIKI, Koki ONDA

活性化された金属(活性金属)にプローブガスを吸着させ、その脱離温度から活性金属 の表面状態を評価することを目的として昇温脱離(TPD)装置を設計、試作した。また、 TPD 装置の性能を評価するために、表面特性が良く知られているシリカ担持ニッケル触 媒(Ni/SiO<sub>2</sub>)の CO-TPD 測定を行った結果、物理吸着および化学吸着した CO に由来す ると考えられる脱離ピークが確認された。このことから、本研究で試作した TPD 装置を 用いることで、活性金属の表面状態を評価できることが確認できた。

キーワード: CO-TPD、シリカ担持ニッケル触媒、物理吸着、化学吸着

Temperature programmed desorption (TPD) apparatus was designed and set up to measure desorption behavior of probe gas like carbon monoxide. It has been, for instance, considered that desorption temperature may reveal chemical state of active site. Therefore, measurement of CO-TPD was made on well-defined silica supported nickel catalyst (Ni/SiO<sub>2</sub>) to confirm performance of the designed TPD apparatus and as a result, physisorbed and chemisorbed CO were recognized on Ni/SiO<sub>2</sub>. These results suggested that surface information on active site of heterogeneous catalysts could be evaluated by using the designed TPD apparatus in this work.

Keywords : CO-TPD, Ni/SiO<sub>2</sub>, physisorption, chemisorption, active sites

### 1 はじめに

金属試料の表面分析には X 線光電子分 光(XPS)や電子線マイクロアナライザー (EPMA)が汎用的に用いられる。しかし、 センターが保有するこれらの装置では、測 定前に試料を外気に露出する必要があり、 触媒や摺動部材といった活性の高い金属表 面を *in situ* で評価することは困難な状況 である。

一方、試料にプローブガスを飽和吸着さ せた後、試料温度を連続的に上昇させた場 合の脱離温度および脱離量を測定する昇温 脱 離 法 (Temperature Programmed Desorption:TPD)では、表1に示す様にプ ローブガス種により固体金属表面に関する 様々な知見が得られる。

表	1	TPD 測定で代表的なプローブガス
種	と得	られる固体表面の情報

プローブガス種	得られる固体表面の情報
СО	活性金属表面積、金属分散度
CO <sub>2</sub>	塩基点の数、強度
$NH_3$	酸点の数、強度

これらを踏まえ、本研究では活性化された金属(活性金属)にプローブガスを吸着させ、その脱離温度から活性金属の表面状態を評価することを目的として、TPD 装置を設計、試作した。また、試作した TPD 装置を用い、表面特性がよく知られているシリカ担持ニッケル触媒(Ni/SiO<sub>2</sub>)の



### 図 1 本研究で作製した TPD 装置の PFD

CO-TPD を測定し、活性金属の表面状態の 評価につながる可能性について検証した。

### 2 TPD 装置の設計および作製

本研究で作製した TPD 装置の PFD を図 1 に示す。配管には外径 3.17mm(内径 2.17mm)のジーエルサイエンス製 SUS316 配管を用い、調圧弁にはユタカ製 GF2-2506-LN-V、ボールバルブ(BV) には Swagelok 製 SS-41GS2、六方切り替えバル ブ(SV) にはジーエルサイエンス製 GS-231、 マスフローコントローラー(MFC) にはコ フロック製 MODEL8500 を用いた。また、 反応床には外径 10mm(肉厚 1mm)の PYREX<sup>®</sup>製ガラスを用い、グリースレスバ ルブには草野科学製 SA-3 を用いた。なお、 反応床の材質にガラスを用いたのは、プロ ーブガスと反応する可能性が低いこと、反 応床内部を目視により観察できること、お よび試料の設置や交換が容易なためである。

反応床の加熱には 0.6kW の電気炉を用 いた。また、反応床温度はシマデン製温調 装置を用い制御し、温度の計測には熱電対 を用いた。さらに反応床からの出口ガスを 直接分析するため、TPD 装置に熱伝導度 検出器型ガスクロマトグラフ(TCD- **GC)(GC-8A**、島津製作所製)をオンライン で接続した。

3 試作 TPD 装置による Ni/SiO₂の CO 昇 温脱離測定

## 3. 1 Ni/SiO2触媒の調製

SiO<sub>2</sub>(Silica Gel60、比表面積 410m<sup>2</sup>/g 、 Merck 製)を電気炉(FO-300、ヤマト科学 製)で 500 ℃で 2 時間焼成した。仕上がり の試料重量基準で Ni が 10wt.%含有される よう、硝酸ニッケル六水和物(Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O、試薬特級、和光純薬製)にイオン交 換水を溶解させた。これにイオン交換水を 加え、飽和吸水量の約 1.2 倍容の硝酸ニッ ケル水溶液を調製した。この水溶液を予め 焼成した所定量の SiO2 に含浸させ、1 時 間静置した。得られたスラリーをロータリ ーエバポレーターに移し、50 ℃に加温し ながらアスピレーターで減圧乾燥後、石英 製炉心管に移し、横型管状電気炉(KTF-30 N、光洋製)で空気を約 200ml/min で通気し ながら 500 ℃で 2 時間焼成し、SiO2 担持 Ni 触媒(Ni/SiO<sub>2</sub>)の前駆体を得た。

### 3.2 試料の前処理

§3.1 で調製した Ni/SiO2 触媒 0.5g をTPD 装置の反応床に設置後、図2に示す



図2 測定試料前処理の温度プロフィール

試料の前処理工程を行った。試料の前処理 時には図1中の SV を切り替え、ガスが破 線部に流れるようにした。以下、具体的な 手順を記載する。

(工程1:昇温) 調圧弁1および BV1を 開け、He ガスを MFC1により流量を 50ml/min に制御し、反応床へ導入しなが ら、反応床を電気炉を用いて室温から 500 ℃に昇温した。このとき 500 ℃に昇温す るまでに 30 分を要した。

(工程2:活性化)反応床の温度を 500℃
 に保持しながら調圧弁1および BV1を閉じ、調圧弁2および BV2を開け、H2を
 MFC1により流量 50ml/min に制御しながら反応床に導入し、1時間保持した。

(工程3:降温)調圧弁2および BV2を 閉じ、調圧弁1および BV1を開けて He ガスを MFC1により流量 50ml/min に制御 し、反応床に導入しながら、反応床温度を 50℃まで降温した。このとき 50℃に降温 するまでに 10 分を要した。

(工程4:CO吸着)調圧弁1およびBV
1を閉じ、調圧弁3およびBV3を開け
10%CO(バランス:He)をMFC1により
流量 50ml/min に制御しながら反応床に導入して1時間保持し、試料にCOを飽和吸着させた。





(工程5:未吸着 CO 除去)調圧弁3および BV3を閉じ、調圧弁1および BV1を開け He ガスを MFC1 により流量 50ml/min で反応床に導入して 10 分間保持し、未吸着の CO を系内より排除した。その後、調 圧弁1および BV1を閉じた。

#### 3. 3 Ni/SiO<sub>2</sub>の CO-TPD 測定

CO-TPD 測定時には調圧弁1および BV 4を開け、かつ SV を切り替えて He が実 線部に流れるようにした。また、He の流 量制御には MFC 2 を用い、流量は 50ml/min (stp) で保持した。反応床を電 気炉で昇温速度 10°C/min で 50 から 500°C まで昇温した。昇温過程で触媒から脱離し てくる CO は分離カラムを用いず、TCD- GC の検出器に導入した。この際に TCD-GC 用の MFC に差圧を持たせるため、ガ ラスビーズ (60~80 メッシュ)を充填し た  $3mm\phi \times 2m$ の SUS 管をカラムの代わり に取り付けた。なお、オーブン温度は 50 °C に保った。

### 4 結果および考察

#### 4. 1 TPD 装置の性能評価

本実験で設計、試作した TPD 装置の性 能を評価するため、Ni/SiO<sub>2</sub> 触媒の CO-TPD 測定を行った。図3に示す様に、脱 離スペクトルには2本のピークが見られ、 低温側及び高温側の CO 脱離ピーク温度は それぞれ98℃ および167℃ だった。

Ni 担持量が 20wt.%の Ni/SiO<sub>2</sub> 触媒を用 いた CO-TPD では、90 ℃ と 180 ℃ にそれ ぞれ物理吸着 CO および化学吸着 CO の脱 離に起因すると思われるピークを示す脱離 スペクトルが報告されている 1)。本研究 で試作した TPD 装置を用いた Ni/SiO2 触媒 の CO-TPD 測定では 98 ℃ と 167 ℃ にそ れぞれピークが観測されたことから、担持 Ni 上の物理吸着 CO および化学吸着 CO を 検出できていると考えられた。脱離温度に 差異が見られたことに関しては、実際に本 研究で用いた Ni 担持量 10wt.%の Ni/SiO2 触媒での脱離ピーク同士は重なっていなか ったのに対し、担持量 20wt.%の Ni/SiO2 触 媒では、低温と高温の脱離ピークが重なる ことが報告されており、後者では、脱離量 が多いためにピーク同士が重なり、見かけ の脱離温度がシフトした可能性が考えられ た。一般的に、金属担持触媒では担持量が 高い場合には、担持金属が還元されやすく 2)、低酸化数を示す傾向がある。このこ とから、Ni 担持量が 20wt.%の Ni/SiO2 触 媒では、Ni 担持量 10wt.%の Ni/SiO2 触媒 に比べ Ni<sup>0</sup>のような還元サイトが多いため に、化学吸着を反映する高温での脱離量が 多く、脱離温度がシフトしたことも影響し ていると推定された。

今回試作した TPD 装置は、CO の吸着エ ネルギー、吸着量を測定することが可能で あることが確認された。今後は、実用部材 の表面状態の考察に活用したい。

### 5. まとめ

①TPD装置を設計、作製した。

②本研究で設計、作製した TPD 装置を用い Ni/SiO2の CO-TPD を行ったところ、2つの CO 脱離ピークが確認され、担持 Ni 上の物理吸着 CO および化学吸着 CO を検出できていると考えられた。

今後、さらに TPD 装置を改良し、プロ ーブガスの金属表面反応による生成物も定 量分析測定できるようにすることで、 in situ な金属表面状態の評価が可能になるも のと思われる。

#### 文献

1)森聰明, 增田浩之, 今井寿穂, 村上雄
 -, *日本化学会誌*, <u>11</u>, 1443-1448(1979)
 2)野沢勲, 白崎高保, *日本化学会誌*, <u>8</u>, 1062-1065 (1978)